中国科学院半导体研究所

第 375 期讲座

报告题目： Topological bulk-defect correspondence

报告人： 蒋建华（中国科学技术大学教授）

个人简介： 2000-2010年在中国科学技术大学学习，获学士和博士学位，后在法国巴黎高等师范学校和加拿大多伦多大学从事博士后研究。2015年起任苏州大学教授，2021年获得国家杰出青年基金，2022年起任

[illegible]

[illegible]

报告内容： [illegible] 2021 [illegible]

[illegible]

[illegible] bulk-edge correspondence. Recently, with designed [illegible] phenomena have been revealed and detects, unve[illegible] correspondence [illegible]

[illegible] topological effects that have never been se[illegible] geometry can induce unique [illegible] new research frontier [illegible]